

半導体集積回路信頼性認定 ガイドラインセミナー

～日本版AEC-Q100車載用電子部品認定規格の紹介～

- 主 催：半導体信頼性技術小委員会
- 担当部署：電子デバイス部
- 参加者数：東京会場64名／名古屋会場37名

概 要

JEITA「半導体技術委員会」の下部組織である「半導体信頼性技術小委員会」では、この度技術レポートとしてJEITA EDR-4708（半導体集積回路信頼性認定ガイドライン）を発行し、啓発活動の一環として7月7日に東京（JEITA 409～411会議室）、7月22日に名古屋（愛知県産業労働センター ウィンクあいち1201）でセミナーを開催いたしました。

本セミナーでは、国内自動車メーカーの有識者にもご参加頂き、車載、デジタルコンシューマ、マルチマーケット分野などの用途要求にあった品質を満足できる技術レポートJEITA EDR-4708への期待を込めてご挨拶

頂きました。

また、各委員から、テキストを基に具体的な方法として適切な信頼性試験時間及び試験個数を導くことで試験のコスト・期間の短縮を実現することが可能であること、実質的な市場、品質を決める初期故障を的確にスクリーニングすることが重要であることが紹介されました。

当委員会では、今後も半導体信頼性技術に関わる有益なセミナーを開催し、参考となる最新の話題を提供したいと考えています。

プログラム

司会 半導体信頼性技術小委員会 認定WG 主査 伊賀洋一 氏（ルネサスエレクトロニクス(株)）

○開催挨拶

半導体信頼性技術小委員会 主査 瀬戸屋孝 氏（(株)東芝 セミコンダクター & ストレージ社）

○「カーエレクトロニクスの進化と本ガイドラインへの期待」

（東京）井上浩一 氏（日産自動車(株)）
野瀬 昇 氏（トヨタ自動車(株)）
齊藤和敬 氏（(株)本田技術研究所）

（名古屋）野瀬 昇 氏（トヨタ自動車(株)）
吉見譲治 氏（(株)デンソー）



○「本ガイドラインの概要紹介」

認定WG 主査 伊賀洋一 氏（ルネサスエレクトロニクス(株)）

○本ガイドラインの詳細紹介『品質グレードと用途～摩耗故障』

認定WG 委員 田子明彦 氏（セイコーエプソン(株)）

○本ガイドラインの詳細紹介『信頼性試験～解説』

認定WG 委員 安西靖仁 氏（ロームグループ OKIセミコンダクタ(株)）

○閉会挨拶

半導体信頼性技術小委員会 副主査 田中政樹 氏（ルネサスエレクトロニクス(株)）

